

[4] M. Pugnet, J. Collet, B. Saint Cioq. *Europhys. Lett.*, 7., 567 (1988).

[5] В. Ф. Гантмахер, И. Б. Левинсон. Рассеяние носителей тока в металлах и полупроводниках, 351. М. (1984).

[6] J. S. Blakemore. *J. Appl. Phys.*, 54, 8123 (1982).

Редактор В. В. Чалдышев

ФТП, том 27, вып. 1, 1993

НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛА МОДУЛЯЦИИ СВЕТА ПРИ КВАДРАТИЧНОЙ РЕКОМБИНАЦИИ В ФОТОПРИЕМНИКЕ

В. А. Малышев, С. В. Сапелкин, Г. Г. Червяков, Е. А. Юхимец

Таганрогский радиотехнический институт им. В. Д. Калмыкова,
347900, Таганрог, Россия

(Получено 1.04.1992. Принято к печати 22.06.1992)

В большинстве современных фотоприемников поступление носителей в зону проводимости осуществляется за счет перевода их светом либо из валентной зоны, либо из примесных уровней, имеющих достаточно большую концентрацию. При этом реализуется квадратичный закон рекомбинации носителей с теми центрами, из которых они ушли, так что уравнение кинетики рекомбинации носителей с концентрацией будет иметь вид [¹]

$$\frac{dn}{dt} = \Phi - dn^2; \alpha = \sigma v = \sigma_0 / v^{(m-1)}, \quad (1)$$

где Φ — скорость световой генерации носителей; σ — поперечное сечение рекомбинации носителей с теми центрами (их концентрация тоже n), из которых они ушли; σ зависит от скорости v хаотического движения носителей, причем эту зависимость можно аппроксимировать [^{2, 3}] степенным законом $\sigma = \sigma_0 / v^m$, где обычно $m \geq 1$. Рассмотрим фотосопротивление длины d , облучаемое по всей поверхности светом. Если внешнее поле, приложенное к нему, равно E , то можно считать

$$v = v_t + \mu E, \quad (2)$$

где v_t — средняя скорость, определяемая тепловым движением носителей заряда; μ — их подвижность. Очевидно, что если свет промодулирован по гармоническому закону, а в цепи фотосопротивления, питаемого от источника с ЭДС, равной ϵ , стоит нагрузочное сопротивление R , то

$$\dot{\Phi} = \Phi_0 + \Phi_1 \sin \omega t; \quad n = n_0 + n_{\sim}; \quad E = E_0 + E_{\sim}, \quad (3)$$

причем

$$\epsilon = (E_0 + E_{\sim}) d + S R e \mu (n_0 + n_{\sim}) (E_0 + E_{\sim}), \quad (4)$$

где S — эффективная площадь поперечного сечения фотосопротивления, e — заряд электрона; так что при $n_{\sim} \ll n_0$ имеем

$$E_0 = \varepsilon / (d + SRe\mu n_0); \quad E_- = - \frac{SRe\mu E_0 n_-}{d + Re\mu S (n_0 + n_-)} \approx - \frac{SRe\mu E_0 n_-}{d + SRe\mu n_0}. \quad (5)$$

(При этом полагается, что сопротивление источника ЭДС по переменному току равно нулю). В том же приближении небольшого сигнала, когда $\mu E_- \ll (\nu_t + \mu E_0)$, можно получить

$$\begin{aligned} 1/\nu^{m-1} &= 1/[(\nu_t + \mu E_0) (1 + \mu E_- / (\nu_t + \mu E_0))]^{m-1} \approx \\ &\approx [1/(\nu_t + \mu E_0)^{m-1}] [1 - (m-1) \mu E_- / (\nu_t + \mu E_0)]. \end{aligned} \quad (6)$$

Подставляя (2)–(6) в (1) и разделяя переменные и постоянные составляющие, получим

$$n_0^2 = \frac{\Phi_0}{\sigma_0} = (\nu_t + \mu E_0)^{m-1}, \quad (7)$$

$$\frac{dn_-}{dt} = \Phi_1 \sin \omega t - An_- - Bn_-^2; \quad A = 2\sigma_0 n_0 / (\nu_t + \mu E_0)^{m-1}, \quad (8)$$

$$\begin{aligned} B &= (2n_0 + n_-) \sigma_0 (m-1) SRe\mu^2 E_0 / (d + SRe\mu n_0) (\nu_t + \mu E_0)^m \approx \\ &\approx 2n_0 \sigma_0 (m-1) SRe\mu^2 E_0 / (d + SRe\mu n_0) (\nu_t + \mu E_0)^m. \end{aligned} \quad (9)$$

Нелинейное уравнение (8) не имеет решения. Поэтому мы воспользуемся итерационным методом, справедливым при $n_0 \gg n_-$. Для этого, считая в нулевом приближении $n_-^2 B = 0$, из (8) получим

$$n_- = n_{-0} = n_1 \sin (\omega t - \varphi); \quad n_1 = \Phi_1 / \sqrt{\omega^2 + A^2}; \quad \varphi = \arctg (\omega/A). \quad (10)$$

Заменяя в (8) $Bn_-^2 \approx Bn_{-0}n_-$ и интегрируя (8), будем иметь в первом приближении

$$\begin{aligned} n_- &= \exp [-At + (Bn_1/\omega) \cos (\omega t + \varphi)] \int \exp [At + (Bn_1/\omega) \times \\ &\times \cos (\omega t + \pi + \varphi)] \Phi_1 \sin \omega t dt + C_1, \end{aligned} \quad (11)$$

где в стационарном режиме постоянная интегрирования $C_1 = 0$. Используя представление

$$e^{N \cos m} = I_0(N) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} I_k(N) \cos km, \quad (12)$$

где $I_k(N)$ — модифицированные функции Бесселя, приведем выражение (11) к виду

$$\begin{aligned} n_- &= e^{-At} \left[I_0(Bn_1/\omega) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} I_k(Bn_1/\omega) \cos [k(\omega t + \varphi)] \right] \times \\ &\times \int e^{At} \Phi_1 \left[I_0(Bn_1/\omega) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} I_k(Bn_1/\omega) \cos [k(\omega t + k + \varphi)] \right] \sin \omega t dt, \end{aligned} \quad (13)$$

который позволяет определить компоненты тока $eS\mu n_- (E_0 + E_-)$, текущего через фотосопротивление. [При желании можно решить (13) уточнить, подставив

(13)омножителем в последний член уравнения (8) и реши его]. В частности, постоянная составляющая этого тока $\dot{I}_{01} = S\mu E_0 \Phi_1$ получит из-за (13) изменение:

$$\dot{I}_0 = \dot{I}_{01} - eS\mu E_0 \Phi_1 \omega I_0(Bn_1/\omega) I_1(Bn_1/\omega)/(A\sqrt{\omega^2 + A^2}), \quad (14)$$

характеризующее эффект детектирования сигнала модуляции света, причем $(i_{01} - i_0) \sim \Phi_1^2$. Точно так же из (13) можно получить, что первая гармоника тока по частоте модуляции

$$i_{\sim 1} = S\mu (n_1 E_0 + n_0 E_{\sim}) = \Phi_1 \frac{d\omega S\mu E_0}{(\omega^2 + A^2)(d + SRe\mu n_0)} I_1^2(Bn_1/\omega) \times \\ \times \left\{ \left[\left(\frac{2\omega}{A} - \frac{\omega^2 + A^2}{\omega \sqrt{(2\omega)^2 + A^2}} \right) + \frac{A}{\omega} \frac{I_0^2(Bn_1/\omega)}{I_1^2(Bn_1/\omega)} \right] \sin \omega t - \right. \\ \left. - \left[2 + \frac{I_0^2(Bn_1/\omega)}{I_1^2(Bn_1/\omega)} \right] \cos \omega t \right\} \quad (15)$$

имеет амплитуду и фазу, нелинейно зависящие от амплитуды $\Phi_1 \sim n_1$ модулирующего сигнала, а вторая гармоника тока

$$i_{\sim 2} = dS\mu E_0 \Phi_1 \frac{I_1(Bn_1/\omega) I_0(Bn_1/\omega)}{(d + SRe\mu n_0) \sqrt{\omega^2 + A^2}} \times \\ \times \left\{ \sin 2(\omega t + \varphi) - \sqrt{\frac{(2\omega)^2 + A^2}{\omega^2 + A^2}} \sin(2\omega t + \varphi) \right\} \quad (16)$$

тоже нелинейно зависит от $\Phi_1 \sim n_1$. Аналогичным образом можно получить соотношения, определяющие все более высокие гармоники частоты модуляции света, выделяемые на нагрузке R . Соотношения (15) и (16) позволяют определить оптимальные значения нагрузочного сопротивления R , обеспечивающие максимум падения напряжения основной частоты (U_{R1}) и гармоники (U_{R2}) на этом сопротивлении. Мы это определение сделаем в малосигнальном приближении и будем полагать $v_t \ll \mu E_0$, $m = 1$. Тогда из (16) и (15) с учетом (9) и (5)

$$U_{R1} \sim \frac{R}{(1 + aR)^2} = f_1(R); \quad a = S\mu n_1/d, \quad (17)$$

$$U_{R2} \sim \frac{R^2}{(1 + aR)^3} = f_2(R). \quad (18)$$

Из условия $df_1/dR = 0$ получается $R = R_{opt1} = 1/a$, а из условия $df_2/dR = 0$ имеем $R = R_{opt2} = 2/a$. Таким образом, оптимальная для переменных составляющих нагрузка, как это следует из (7), зависит от постоянной составляющей светового потока ($\sim \Phi_0$), причем R_{opt} падает по мере его роста.

Проведенное рассмотрение и полученные соотношения позволяют сделать вывод о перспективности использования обычных фотосопротивлений с квадратичной рекомбинацией для нелинейных преобразований сигнала модуляции светового потока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Р. Бьюб. Фотопроводимость твердых тел, 558. М. (1962).
- [2] В. С. Вавилов. Действие излучений на полупроводники, 264. М. (1963).
- [3] В. А. Малышев. Теория разогревных нелинейностей плазмы твердого тела, 264. Ростов-на-Дону (1979).

Редактор В. В. Чалдышев

ФТП, том 27, вып. 1, 1993

ОСОБЕННОСТИ ФОТОПРОВОДИМОСТИ КЛАССИЧЕСКИХ СВЕРХРЕШЕТОК НА ОСНОВЕ *p*-Ge В ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ

В. Н. Гусятников, В. А. Иванченко, М. В. Николаев

Научно-исследовательский институт механики и физики при Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского, 410019, Саратов, Россия
(Получено 21.04.1992. Принято к печати 26.06.1992)

В последнее время проявляется интерес к исследованию внутризонного поглощения света в сложных полупроводниковых структурах типа сверхрешеток и гетероструктур с целью создания на их основе быстродействующих приемников лазерного и теплового излучения (см., например, [1, 2]).

В настоящей работе проведен анализ фотопроводимости в классических (не имеющих минизонного спектра) легированных сверхрешетках (СР) на основе Ge *p*-типа проводимости при воздействии лазерного излучения дальнего ИК диапазона.

Особенностью внутризонного поглощения света в *p*-Ge является наличие прямых переходов свободных носителей заряда из зоны тяжелых в зону легких дырок. При этом начальная энергия ϵ_n , с которой дырка может совершить такой переход, однозначно задается энергией кванта излучения $\hbar\omega$. Для температур, сравнимых с ϵ_n , поглощение ИК излучения в *p*-Ge можно рассматривать, ограничиваясь прямыми межзонными переходами [3, 4]. В этом случае процесс термализации фотовозбужденных дырок можно разделить на следующие этапы: 1) переход дырки с энергией $\epsilon_n + \hbar\omega$ из зоны легких в зону тяжелых дырок в результате взаимодействия с оптическими или акустическими фононами; 2) последовательное испускание определенного числа оптических фононов $\hbar\omega_0$, время релаксации на которых в данном случае существенно меньше других времен релаксации [5], и переход дырок в состояние с энергией $\epsilon_k < \hbar\omega_0$; 3) медленная релаксация дырок по энергии от ϵ_k до ϵ_n на акустических фононах или междузарядных столкновениях. В рамках этой модели поглощения света в работе [6] было получено аналитическое выражение для функции распределения дырок f в *p*-Ge. При этом предполагалось, что в области энергий $\epsilon_n < \epsilon < \epsilon_k$ рассеяние дырок происходит на акустических фононах, а взаимодействие с оптическими фононами и междузарядное рассеяние несущественны, что накладывает ограничения сверху на температуру и концентрацию примеси. Согласно [6],

$$f = A(\epsilon)f_0 + \delta f, \quad (1)$$

где $A(\epsilon)$ — некоторая функция, связанная с величиной и энергетическим положением области релаксации фотовозбужденных дырок; f_0 — невозмущенная